



VDE

INSTITUTE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH • Merianstr. 28 • 63069 Offenbach

NXP Semiconductors Czech  
Republic s.r.o.  
1. Maje 1009  
756 61 ROZNOV POD RADHOSTEM  
Czech Republic

Offenbach, 2021-02-23

Your ref.  
Jozef Sedlak

Your letter  
2020-12-21

Our ref. - please indicate  
5016540-4970-0002/280529  
TL2/scb

Contact  
Mr. Dipl.-Ing. Schildbach  
Tel +49 69 8306 524  
Fax +49 69 8306 789  
joachim.schildbach@vde.com

*Translation: In any case the German version shall prevail*

**P R Ü F B E R I C H T**  
**zur Information des Auftraggebers**  
***Test Report for the Information of the applicant***

**Produkt / Product:** Micro Controller

**Typ / Type:** with ARM CM4 and CM7 core

Dear Sirs,

dieser Prüfbericht enthält das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnis. Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft, um die Übereinstimmung mit den nachfolgend aufgeführten Normen bzw. Abschnitten von Normen festzustellen.  
Die Prüfung wurde durchgeführt vom 2021-02-16 bis 2021-02-23.

*This test report contains the result of a singular investigation carried out on the product submitted. A sample of this product was tested to find the accordance with the thereafter listed standards or clauses of standards resp. The testing was carried out from 2021-02-16 to 2021-02-23.*

Der Prüfbericht berechtigt Sie nicht zur Benutzung eines Zertifizierungszeichens des VDE und berücksichtigt ausschließlich die Anforderungen der unten genannten Regelwerke.

*The test report does not entitle for the use of a VDE Certification Mark and considers solely the requirements of the specifications mentioned below.*



Wenn gegenüber Dritten auf diesen Prüfbericht Bezug genommen wird, muss dieser Prüfbericht in voller Länge an gleicher Stelle verfügbar gemacht werden.

*Whenever reference is made to this test report towards third party, this test report shall be made available on the very spot in full length.*

## I BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Produkt / Product: Selbst-Diagnose-Routinen für Milro-Controller mit ARM CM0+ Core  
*Self-Diagnostic Routines for Micro Controllers with ARM CM0+ Core*

Typ / Type:	Dateiname / File name	Version / Version
	iec60730b_cm4_cm7_reg.S	4.x
	iec60730b_cm4_cm7_reg_fpu.S	4.x
	iec60730b_cm4_cm7_pc.S	4.x
	iec60730b_cm4_cm7_pc_object.S	4.x
	iec60730b_cm4_cm7_flash.S	4.x
	iec60730b_cm4_cm7_flash_dcp.c	4.x
	iec60730b_cm4_cm7_ram.S	4.x
	IEC60730B_M4_M7_IAR_v4_1.a*	4.x
	IEC60730B_M4_M7_KEIL_v4_1.lib*	4.x
	libIEC60730B_M4_M7_MCUX_v4_1.a*	4.x

Remark: The files marked with \* are object code files.

The files referenced under this test report are also suitable for device families with CM4 and CM7 core referenced under VDE folder 5016540-4970-0008 for common/peripheral features with its actual test report.

**II NORMEN / STANDARD**

**Prüfnorm(en) / Standard(s) used:**

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2020-08

Annex R

EN 60335-  
1:2012+AC+A11+A13+A1+A2+A14:2019

Annex R

DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1):2017-05

Annex H

EN 60730-1:2016

EN 60730-1:2016/A1:2019

Annex H

IEC 60335-1:2010

IEC 60335-1:2010/AMD1:2013

IEC 60335-1:2010/AMD2:2015

Annex R

IEC 60730-1:2013

IEC 60730-1:2013/AMD1:2015

IEC 60730-1:2013/AMD2:2020

Annex H



**III PRÜFUNG / TEST**

Die unter I benannten Selbst-Diagnose-Routinen sind vorgesehen für folgende Maßnahmen nach Tabelle R.1 / H.1 der unter II benannten Normen. /

*The self-diagnostic routines mentioned under I are foreseen for following measures of table R.1 / H.1 of the standards mentioned under II.*

Dateiname / File name	Maßnahme / Measure
iec60730b_cm4_cm7_reg.S iec60730b_cm4_cm7_reg_fpu.S	1.1 Register
iec60730b_cm4_cm7_pc.S iec60730b_cm4_cm7_pc_object.S	1.3 Programme counter
iec60730b_cm4_cm7_flash.S iec60730b_cm4_cm7_flash_dcp.c	4.1 Invariable memory
iec60730b_cm4_cm7_ram.S	4.2 Variable memory

Zu Details der Prüfungen siehe VDE-Prüfbericht /  
*For details of testing see VDE Test Report:*

280529-TL2-1

**IV ERGEBNIS / RESULT**

Die unter I benannten Selbst-Diagnose-Routinen erfüllen die Anforderungen der unter II benannten Normen. Die unter I benannten Selbst-Diagnose-Routinen können zum Aufbau einer Selbst-Test-Bibliothek gemäß der unter II benannten Normen verwendet werden. /

*The self-diagnostic routines mentioned under I fulfill the requirements of the standards mentioned under II. The self-diagnostic routines mentioned under I are suitable to be used to create a self-test library according the standards mentioned under II.*

Best regards

VDE Testing- and Certification Institute  
Appliances and Systems for House and Commercial Use

Dipl.-Ing. (FH) K. Tas

Dipl.-Ing. (FH) J. Schildbach